04;07;12

Характеристики многоэлектродного коронного разряда в рабочих средах импульсно-периодических XeCI* и KrCI* лазеров

© А.К. Шуаибов

Ужгородский государственный университет, 294000 Ужгород, Украина

(Поступило в Редакцию 3 марта 1997 г.)

Представлены результаты исследования электрических и оптических характеристик многоэлектродного коронного разряда отрицательной полярности в смесях He/Xe(Kr)/CCl₄, являющихся рабочими средами импульсно-периодических лазеров на хлоридах инертных газов. Коронный разряд изучался в системе электродов иголки-сетка, длина которой примерно равна длине активной среды лазера. Такой коронный разряд представляет интерес для применения в модулях электрической прокачки рабочих сред XeCl* и KrCl* лазеров, в рабочих средах которых используются пары жидких углеводородов типа CCl₄.

Введение

Электроразрядные лазеры на хлоридах инертных газов (RCl*), в состав рабочих смесей которых входят сложные хлорсодержащие молекулы BCl₃, CCl₄ [1–4], имеют в некоторых режимах работы более высокие энергетические и ресурсные характеристики, чем при использовании молекул хлористого водорода. Применяемые при этом механические системы поперечной прокачки рабочих смесей характеризуются значительным энергопотреблением, вибрацией и шумом, а также вызывают дополнительное загрязнение рабочей смеси.

В импульсно-периодическом XeCl* лазере, работающем на смеси He/Xe/HCl, при частотах повторения $f \leq 70$ Hz возможно использование электрической прокачки со средней скоростью поперечного потока газовой смеси ≤ 3 m/s [5]. Данный способ замены горячих агрессивных газовых смесей высокого давления свободен от некоторых недостатков механических систем прокачки и основан на использовании многоэлектродного коронного разряда (KP), равномерно распределенного по длине поперечного разряда импульсно-периодического эксимерного лазера.

В работе [6] приведены результаты исследования некоторых характеристик подобно КР в рабочих средах электрозарядных RCl* лазеров, основанных на использовании в качестве хлорносителя молекул HCl.

В настоящей работе приводятся результаты исследования характеристик многоэлектродного КР на смесях He/Kr(Xe)/CCl₄, зажигаемого в системе электродов иголки–сетка и предназначенного для применения в излучателе миниатюрного импульсно-периодического RCl^{*} лазеров с электрической прокачкой рабочей среды.

Техника эксперимента

КР зажигался в разрядной камере высокого давления, изготовленной из нержавеющей стали. Система электродов КР устанавливалась на диэлектрическом фланце рязрядной камеры и состояла из одного ряда иголок и никелевой сетки. Длина системы электродов 12 cm, а расстояние между остриями иголок и сеткой равнялось 2 ст. Радиус закругления острия иголок составлял 0.5 mm, а диаметр проволочек сетки — 0.3 mm. На иголки через внешнее ограничительное сопротивление подавалось постоянное напряжение отрицательной полярности ($U \le 12$ kV, $I_{mid} \le 15$ mA). Измерение электрических и оптических характеристик КР проводились при помощи системы регистрации, описанной в работах [6,7]. Оптические исследования излучения плазмы проводились при полном обзоре всего межэлектродного промежутка через входную щель монохроматора. Контрольные эксперименты показали, что основной вклад в излучение плазмы вносят горячие зоны, возникающие вблизи острия иголок. Поэтому с точностью до 5-10% можно считать, что исследуются характеристики горячих зон данного КР.

Многоэлектродный КР в данных экспериментах наблюдался в виде ярких горячих зон (вблизи остриев иголок), мелких горячих зон у сетки и темной или слабосветящейся внешней области КР, расположенной между иголками и сеткой.

Электрические характеристики

По сравнению с аналогичным КР в двойных смесях (без примесей хлорсодержащих молекул) в исследуемых средах отсутствует интенсивный тлеющий разряд во внешней области, а максимальная величина тока разряда на неконтрагированной стадии уменьшается на один–два порядка. Ток КР при этом определяется не величиной балластного сопротивления, а плотностью электроотрицательных молекул в смеси [6]. С превышением определенной, критической величины напряжения на иголках КР контрагируется, что проявляется в образовании анодного стримера возле одной из иголок.

Усредненные вольт-амперные характеристики (УВАХ) КР в смесях инертных газов с молекулами CCl₄ приведены на рис. 1. Полученные УВАХ не описываются зависимостями типа $I = \alpha (U - U_0)^2$ (где α — постоянная, U_0 — потенциал зажигания разряда), наиболее типичными для КР [8]. На УВАХ КР в смеси He/CCl₄ видны две разные стадии КР, характеризующиеся своими пороговыми напряжениями и скоростями роста тока КР. Эти стадии отличаются линейными зависимостями типа $I_{\text{mid}} = \beta (U - U_0)$. Величины U_0 и β для слаботочной и сильноточной стадии КР в смеси He/CCl₄ составляют соответственно $U_0^1 = 5.5 \text{ kV}, \beta^1 = 50 \,\mu\text{A/kV}$ и $U_0^2 = 8.75 \,\text{kV},$ $\beta^2 = 1000 \,\mu\text{A/kV}$. В тройных смесях наблюдалась только слаботочная стадия КР, и в этом случае форма УВАХ более близка к линейной.

Отличия полученных УВАХ от типичных для КР связаны с проявлением нелинейностей КР в инертных газах [9], из которых следует, что в данных средах возможно получение разряда со свойствами промежуточными между коронным и тлеющим разрядами. Гистерезис УВАХ в отличие от УВАХ КР в смесях He/Kr(Xe) практически отсутствует, что может быть связано с тушением метастабильных атомов R(m) галогенсодержащими молекулами [10,11].

Скорость прокачки газов в КР $v \sim (I)^{1/2}$ [12], поэтому она будет выше в ксенонсодержащих средах при минимальном содержании молекул CCl₄. Увеличение содержания CCl₄ выше 0.13 kPa нежелательно из-за уменьшения эффективности работы эксимерного лазера [3,4]. При уменьшении давления тройной смеси до 100 kPa сужается диапазон устойчивого существования КР по величине напряжения, а ток КР увеличивается в 1.5 раза. Зависимости $I_{mid} = f(U)$ становятся при этом квадратичными.



Рис. 1. Вольт-амперные характеристики отрицательного коронного разряда в смесях инертных газов с молекулами CCl₄. $I - \text{He}/\text{CCl}_4 = 220/0.13 \text{ kPa}; 2 - \text{He}/\text{He}/\text{CCl}_4 = 220/2, 8/0, 13 \text{ kPa}; 3 - \text{He}/\text{Kr}/\text{CCl}_4 = 220/16/0, 13 \text{ kPa}.$



Рис. 2. Форма импульсов тока (*a*) и зависимость частоты их повторения от величины напряжения на иголках (*b*) для КР в смеси He/Xe/CCl₄ = 220/2, 8/0, 13 кPa.

На рис. 2 приведены форма импульса тока КР и зависимость частоты повторения импульсов от величины напряжения на иголках. Для КР в тройных смесях длительность импульсов тока на полувысоте составляет $0.3...0.5\,\mu$ s. Импульсы тока КР наблюдались на фоне постоянного тока. Как видно из рис. 2, b, импульсы тока КР в тройных смесях проявляются только на предконтрактной стадии разряда, а их частота повторений, как и в средах на основе молекул HCl [6], достигает 30–40 kHz. В КР на двойной смеси импульсы тока по ширине достигали $1.5\,\mu$ s и наблюдались только в области $\Delta U = 6-8$ kV, а на сильноточной стадии КР ток был непрерывным.

Оптические характеристики

Спектры излучения плазмы горячих зон КР в двойной и тройной смеси приведены на рис. 3. Для КР на смеси Не / CCl₄ в УФ области спектра наблюдается образование молекул Cl₂^{*} (λ 258 nm) и радикалов CCl^{*} (λ 278 nm). При этом наиболее интенсивной является полоса излучения Cl₂. Континиум в области $\lambda\lambda$ 450–850 nm, происхождение которого связано с распадом радикалов CCl₃ или C₂Cl₄, наблюдавшийся в разряде постоянного

Рис. 3. Спектры излучения плазмы КР в смесях $He/CCl_4(a)$ и $He/Xe/CCl_4(b)$.

тока при низких давлениях в [13,14], отсутствует. По данным [13] в первичных актах распада молекул CCl₄ под действием электронов образуются преимущественно радикалы CCl₂, CCl₃, Cl₂^{*} и атомы Cl^{*}, а радикалы CCl^{*} образуются в результате вторичных реакций. Низкая интенсивность излучения полосы CCl^{*} (по сравнению с излучением Cl₂^{*}) связана с быстрыми реакциями его гибели в столкновениях с другими радикалами или молекулами Cl₂^{*}.

Исследование обзорных спектров плазмы КР в тройной смеси (рис. 3, b) в диапазоне $\lambda\lambda$ 200–1000 nm показало, что основными являются полосы излучения λ 308 nm XeCl (B-X), λ 222 nm KrCl (B-X) и более слабые широкие полосы λ 330 nm XeCl (C-A) и λ 230 nm KrCl (C-A). В ближней ИК и видимой областях спектра наиболее интенсивные линии излучения наблюдались на переходах Kr (5s-6p, 5p) и и Xe (6s-7p, 6p). Линии излучения с состояний, лежащих выше энергии первого колебательного состояния молекулярных ионов R_2^+ , и возбужденных ионов тяжелых инертных газов отсутствовали.

Такой характер распределения интенсивности в линейчатом спектре излучения может быть вызван заселением *p*-состояний атомов Kr и Xe в реакциях диссоциативной рекомбинации [15] и при возбуждении электронным ударом [16,17].

Типичные зависимости средних интенсивностей излучения молекулярных полос и линий атомов Kr, Xe от величины среднего тока KP представлены на рис. 4 и 5. Все эти зависимости имеют линейный вид. Из молекул наиболее эффективно образуются эксимерная молекула KrCl (*B*) и наименее эффективно молекулы Cl_2^* . Интенсивность излучения на переходах Xe (6*s*-6*p*), Kr (5*s*-5*p*) более чем на два порядка превышает интенсивность излучения с более высоколежащих состояний (рис. 5). Интенсивность изучения атомов Xe и Kr на ИК переходах в KP на смесях He/Xe(Kr) (сравнимые по величине с приведенными на рис. 5) достигались в чистых инертных газах только при средних токах KP 1 mA. При этом ток КР был в основном непрерывным. Это указывает на эффективную столкновительную очистку метастабильных Xe (6s) и Kr (5s) состояний в КР на тройных смесях. Константы скорости тушения для Xe (6p) молекулами CCl₄ находятся в пределах $7.3-7.8 \cdot 10^{-10}$ cm³/s, а для метастабильных состояний Xe (6s) они составляют $6.3 \cdot 10^{-10}$ cm³/s [11].



Рис. 4. Зависимости относительной интенсивности полос излучения молекул от величины среднего тока КР. $1 - \lambda = 258 \text{ nm Cl}_2^*$, He/CCl₄; 2 — 308 nm XeCl (*B*-*X*), He/Xe/CCl₄; 3 — $\lambda = 222 \text{ nm KrCl } (B-X)$, He/Kr/CCl₄.



Рис. 5. Зависимости относительной интенсивности излучения линий Xe^{*} и Kr^{*} от величины среднего тока KP. $1 - \lambda = 467 \text{ nm Xe} (6s - 7p); 2 - \lambda = 823 \text{ nm Xe} (6s - 6p);$ $3 - \lambda = 810 \text{ nm Kr} (5s - 5p).$

Журнал технической физики, 1998, том 68, № 5

Плазма в горячей зоне КР сильно обогащена метастабильными атомами инертных газов, что связано со специфическим видом функции распределения электронов по энергии в КР, которая обрезана со стороны высоких энергий. Концентрация ионов в КР значительно ниже концентрации метастабильных и возбужденных на низколежащие энергетические состояния атомов [18]. Поэтому в горячих зонах КР превалирующей реакцией образования эксимерных молекул может быть "гарпунная" реакция:

$$R(np, ns) + \operatorname{CCl}_4 \to \operatorname{RCl}(B, C) + \operatorname{CCl}_3.$$
(1)

Для атомов ксенона коэффициент ветвления реакции тушения Xe (6p, 6s) молекулами CCl₄ с образованием XeCl (B, C) в процессе с участием Xe (6p) значительно выше (0.6-0.7), чем для Xe (6s) (0.24). Одинаковый характер, зависимости интенсивности излучения полосы XeCl (B-X) и линий на переходах Xe (6s-6p) также косвенно подтверждает образование эксимерной молекулы в "гарпунной" реакции.

В КР не наблюдается характерное для импульсного поперечного разряда увеличение интенсивности излучения RCl* со временем работы разрядного устройства на смесях инертных газов с молекулами CCl₄. Это связано с тем, что в плазме RCl* лазеров молекулы CCl₄ прямо не участвуют в образовании эксимерных молекул. Сначала происходит реакция распада CCl₄:

$$\operatorname{CCl}_4 + \operatorname{H}_2 + \eta \nu \to 2\operatorname{HCl} + \operatorname{Cl}_2, \tag{2}$$

а в дальнейшем образование эксимерных молекул идет по кинетической цепочке RCl* лазеров на рабочих средах с примесями молекул HCl [3].

Выводы

Исследование характеристик многоэлектродного коронного разряда в рабочих средах импульсно-периодических лазеров на хлоридах инертных газов показало, что он характеризуется малым энергопотреблением $(W \leq 1 \, \mathrm{W})$ и устойчиво зажигается в смесях типа He / Xe(Kr) / CCl₄; ток разряда и скорость прокачки газовых смесей ограничены развитием неустойчивости при высоком напряжении на иголках; для увеличения скорости прокачки необходимо применять газовые среды, обедненные молекулами CCl₄ и использовать несколько параллельно включенных модулей прокачки; электрические характеристики и вид КР в значительной степени определяются процессами прилипания электронов к молекулам CCl₄ и подвижностью соответствующих отрицательных ионов; эксимерные молекулы в горячих зонах КР могут образовываться преимущественно в прямых "гарпунных" реакциях с участием молекул CCl₄ и атомов Xe (6p, 6s), Kr (5p, 5s); молекулы CCl₄ приводят к эффективному расселению метастабильных состояний атомов Xe и Kr и росту интенсивности на ИК переходах Xe (6*s*-6*p*) и Kr (5*s*-5*p*).

Список литературы

- [1] Peet V.E., Treshalov A.B., Slivinski E.B. // Appl. Phys. B. 1991. Vol. 52. P. 234–243.
- [2] Малинин А.Н., Шимон Л.Л., Добош В.М., Хомяк Б.Я. // Квантовая электрон. 1994. Т. 21. № 12. С. 1174–1177.
- [3] Salimbeni R., Matera M., Vannini M., Burlamachi P. // Opt. Commun. 1981. Vol. 39. N 1. P. 75–78.
- [4] Luches A., Nassisi V., Perrone M.R. // Opt. Commun. 1984.
 Vol. 51. N 5. P. 315–318.
- [5] Баранов А.И., Гурков К.В., Ломаев М.И. н др. // ПТЭ. 1994. С. 108–111.
- [6] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Шевера И.В. // Квантовая электрон. 1997. Т. 24. № 2.
- [7] Шуаибов А.К., Миня А.И., Звенигородский В.В., Шевера В.С. // Письма в ЖТФ. Т. 22 Вып. 13. С. 73–78.
- [8] Henson P.L. // J. Appl. Phys. 1981. Vol. 52. N 2. P. 709-719.
- [9] Белевцев А.А. // Тез. докл. IV Всесоюз. конф. по физике газового разряда. Махачкала: ДГУ. 1988. Ч. 1. С. 15–16.
- [10] Velazco J.E., Kolts J.H., Setser D.W. // J. Chem. Phys. 1976. Vol. 65. N 9. P. 3468–3488.
- [11] Ku J.K., Setser D.W. // Appl. Phys. Lett. 1986. Vol. 48. N 11. P. 689–693.
- [12] Верещагин И.П. Коронный разряд в аппаратах электронно-ионной технологии. М.: Энергоатомиздат, 1985.
- [13] Кравченко Ю.С., Осадчук В.С., Словецкий Д.И., Коровянко В.Н. // ХВЭ. 1989. Т. 23. № 5. С. 444–449.
- [14] Кравченко Ю.С., Осадчук В.С., Словецкий Д.И., Таранов С.В. // ХВЭ. 1989. Т. 23. № 6. С. 539–544.
- [15] Иванов В.А. // УФН. 1992. Т. 162. № 1. С. 35-70.
- [16] Фельцман П.В., Запесочный И.П. // УФЖ. 1968. Т. 13. № 2. С. 205–210.
- [17] Mason N.J., Nevel W.R. // J. Phys. B. 1987. Vol. 20. P. 1357–1377.
- [18] Песков В.Д. // ЖТФ. 1975. Т. 45. Вып. 12. С. 2544-2551.